

Part 4 サンビーム成果発表一覧

2015 年度下期～2016 年度上期

発表形式

- 1 : 原著論文／博士論文／査読付きプロシーディングス
- 2 : 総説
- 3 : 査読なしプロシーディングス
- 4 : 単行本
- 5 : 賞
- 7 : その他の出版物
- 8 : 招待講演
- 9 : 口頭／ポスター発表(サンビーム研究発表会を含む)
- 10 : SPring-8 利用研究成果集
- 11 : 公開技術報告書
- 12 : プレス発表／取材(新聞、テレビ、雑誌等々マスコミ関係取材)

SB No. : サンビーム成果登録番号

JASRI No. : JASRI 研究成果番号



サンビーム成果発表一覧 発表形式 1,10,11

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
11	817	31145	2012A5010, 2012B5010 2013A5010	積層造形品の残留応力評価	日比野 真也
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.119-121 [2016/3]	川崎重工業(株)
11	818	31146	2013B5310, 2014A5310 2014B5310, 2015A5310	ガス雰囲気変動下における三元触媒中の酸化セリウムの価数評価	松田 千明
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.122-125 [2016/3]	川崎重工業(株)
11	819	31373	2013A5320, 2013B5320 2014A5320, 2014B5320	XAFSとSANSを併用した鋼材表面の腐食過程の評価(2)	横溝 臣智
				サンビーム年報成果集 Vol.5 2015, p.115-118 [2016/3]	(株)コベルコ科研
11	820	31818	2013B5020, 2014A5020 2014B5020	Si添加鋼の加熱中のスケール生成挙動の観察	中久保 昌平
				サンビーム年報成果集 Vol.5 2015, p.112-114 [2016/3]	(株)神戸製鋼所
1	821	32451	2006A5311, 2006B5311	Physical Properties of Iron-Oxide Scales on Si-Containing Steels at High Temperature Materials Transactions, Vol. 50, No. 9 (2009) pp. 2242 to 2246	武田 実佳子 (株)神戸製鋼所
1	822	32444	2005B5311, 2006A5311 2006B5311, 2009A5321	鉄鋼材料製造過程に生成するスケールの性状と高温物性に関する研究 博士論文(大阪大学工学研究科)[2010/03]2010-03-23	武田 実佳子 (株)神戸製鋼所
11	823	31063	2013B5330, 2014A5330 2014B5030	非晶質IGZO膜の構造解析	飯原 順次
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.108-111 [2016/3]	住友電気工業(株)
11	824	31064	2014A5030	X線散乱による非晶質炭素材料の構造解析	斎藤 吉広
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.104-107 [2016/3]	住友電気工業(株)
1	825	31701	2013B1568, 2015A5330	A High Temperature Reduction Cleaning (HTRC) Process: a Novel Method for Conductivity Recovery of Yttrium-Doped Barium Zirconate Electrolytes J. Mater. Chem. A 4 (2016) 10601-10608 [2016/6]	Han Donglin 京都大学 (共同研究: 住友電気工業(株))
11	826	31913	2012A5340, 2012B5340 2013A5340	Ruコア/Ptシェル触媒ナノ粒子における粒子サイズ効果	後藤 習志
				サンビーム年報・成果集, Vol.5 2015, p.97-99 [2016/3]	ソニー(株)
11	827	31914	2013A5340, 2013B5340	Sn系ナノ粒子の電気化学的in situ XAFS測定	細井 慎
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.100-103 [2016/3]	ソニー(株)
11	828	31119	2013B5060	強誘電性Hf(Si)O膜の構造解析	高石 理一郎
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.80-82 [2016/3]	(株)東芝
11	829	31939	2014A5060, 2014B5060 2015A5060, 2015B5060	硬X線光電子分光法によるゲルマニウムスズ薄膜結晶の深さ方向状態評価	臼田 宏治
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.83-86 [2016/3]	(株)東芝
11	830	32018	2012A5360, 2013A5360 2013B5360, 2014A5360 2014B5360	ガラス中アンチモンの価数評価手法の開発	沖 充浩
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.87-89 [2016/3]	(株)東芝
1	831	31827	2013A5350, 2013B5350 2014A5350, 2014B5350 2015A5350, 2015B5350	XAFS Speciation Study of Selenium Compounds with Different Oxidation State in Soil and Combustion Ash 粉体工学学会誌 (Journal of the Society of Powder technology, Japan), 53, (2016)142-148	山本 融 (一財)電力中央研究所

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目		筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]		
11	832	31828	2013A5350, 2013B5350 2014A5350, 2014B5350 2015A5350, 2015B5350	XAFS Study of Trace Element-XAFS Analysis by using of BCLA 電力中央研究所報告 研究報告 (Research Report of Central Research Institute of Electric Power Industry) (2016).M15003	山本 融 (一財)電力中央研究所	
11	833	31909	2012B5320, 2013A5350 2013B5350, 2014A5350 2014B5350	XAFSによる微量な水銀の化学形態分析法 サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.93-96 [2016/3]	山本 融 (一財)電力中央研究所	
11	834	32066	2013A5050, 2013B5050 2014A5050, 2014B5050	Williamson Hall法によるガスタービン動翼用Ni基超合金のクリープ損傷評価 サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.90-92 [2016/3]	向井 康博 関西電力(株)	
1	835	32067	2013A5050, 2013B5050 2014A5050, 2014B5050	CREEP DAMAGE EVALUATION OF Ni-BASE SUPERALLOY BASED ON X-RAY DIFFRACTION LINE BROADENING High-Temperature Materials Technology for Sustainable and Reliable Power Engineering Proceedings, pp.210-213	向井 康博 関西電力(株)	
1	836	32068	2013A5050, 2013B5050 2014A5050, 2014B5050	X-ray diffraction study on inelastic deformation behavior of Ni-base single crystal superalloy Procedia Structural Integrity, Volume 2, 2016, Pages 895-902	向井 康博 関西電力(株)	
1	837	30388	2011B5370, 2012A5370 2012B5370, 2013A5370	Formation of Helical Dislocation in Ammonothermal GaN Substrate by Heat Treatment Semicond. Sci. Technol. 31 (2016) 034002	堀淵 嘉代 (株)豊田中央研究所	
11	838	31516	2008A5071, 2009B5072 2010B5070, 2011A5071 2011B5070, 2012A5070	Detection of Pr in Cs Ion-implanted Pd/CaO Multilayer Complexes with and without D2 Gas Permeation サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.71-75 [2016/3]	高橋 直子 (株)豊田中央研究所	
11	839	30961	2013B5070, 2014A5072 2014B5072	微小角入射X線散乱(GIXS)によるDLC膜の構造解析 サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.76-79 [2016/3]	伊関 崇 (株)豊田中央研究所	
1	840	31207	2012A5371, 2013A5370 2014A5370, 2014B5371	Trials of Solution Growth of Dislocation-Free 4H-SiC Bulk Crystals Materials Science Forum 858 (2016) p.19-22	旦野 克典 トヨタ自動車(株)	
11	841	31128	2013B5380, 2014A5380 2014B5380	偏光XAFS及びFEFFを用いたInGaN結晶のIn分布可視化 サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.67-70 [2016/3]	吉成 篤史 日亜化学工業(株)	
11	842	31873	2014A5080, 2014B5080 2015A5080	放射光マイクロビームX線による高効率LED発光層の評価 サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.63-66 [2016/3]	榊 篤史 日亜化学工業(株)	
1	843	31296	2012A5390, 2012B5391	In situ X-Ray Absorption Fine Structure Analysis of PtCo, PtCu and PtNi Alloy Electrocatalyst-The origin for Enhanced Activity of Oxygen Reduction Reaction- J. Phys. Chem. C, 2016, 120 (21), pp 11519-11527	垣内 孝宏 日産自動車(株)	
1	844	30289	2014A5090, 2014B5390 2013A1234, 2014A1558 2014B1015, 2015A1704 2014B1594	Impact of FEC Additive on SEI Structure Formed on a Carbon Negative Electrode Studied by HAXPES ECS Trans. 2015 Volume 69, issue 21, 13-25	松本 匡史 (株)日産アーク	
1	845	32274	2012A5392, 2012A5090, 2012B5392 2012B5392, 2013A5091, 2013A5392 2013B5090, 2013B5391, 2013B5392 2014A5091, 2014A5392, 2014B5092	A valence state evaluation of a positive electrode material in a Li-ion battery with first-principles K- and L-edge XANES spectral simulations and resonance photoelectron spectroscopy J. Appl. Phys. 120, 142125 (2016)	久保 啓 (株)日産アーク	
1	846	32441	2013A5392, 2013B5391 2014A5391, 2014B5390 2014B5391	Platinum-Iron-Nickel Trimetallic Catalyst with Superlattice Structure for Enhanced Oxygen Reduction Activity and Durability Ind. Eng. Chem. Res. 2016, 55, 11458-11466	黒木 秀記 (公財)神奈川科学技術 アカデミー (共同研究: (株)日産アーク)	

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
11	847	30997	2013A5090, 2014B5090	In situ XRDを用いた充放電中のSiO ₂ /C電極における各活物質の反応挙動解析	高橋 伊久磨 日産自動車(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.59-62 [2016/3]	
11	848	31181	2014B5120, 2015A5120	硬X線光電子分光法による保存試験前後におけるリチウムイオン二次電池の負極表面解析	大川 真弓 パナソニック(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.53-55 [2016/3]	
11	849	31182	2014B5420, 2015A5420	XAFSを用いた新規ニオブ窒化物中のニオブ価数分析	藏淵 孝浩 パナソニック(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.56-58 [2016/3]	
1	850	31314	2013A5100, 2012B5100 2012A5100, 2011B1649 2011A2003, 2012B1193	Pt-Ti-O Gate Silicon-Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistor Hydrogen Gas Sensors in Harsh Environments	宇佐川 利幸 (株)日立製作所
				Jpn. J. Appl. Phys., 55, 067102 (2916) [2016/05]	
11	851	30599	2014A5100, 2013B5100 2013A5100	硬X線磁気顕微鏡による焼結ネオジム磁石の磁化反転過程の観察	上田 和浩 (株)日立製作所
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.45-48 [2016/3]	
11	852	30600	2015A5400, 2014B5400 2014A5400	サブピクセルシフト法を用いた超解像X線CTの開発	米山 明男 (株)日立製作所
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.49-52 [2016/3]	
1	853	32059	2014B5100, 2014A5100 2013B5100, 2013A5100	Measuring Magnetisation Reversal in Micron-Sized Nd ₂ Fe ₁₄ B Single Crystals by Microbeam X-ray Magnetic Circular Dichroism	菅原 昭 (株)日立製作所
				Journal of Physics D: Applied Physics 49, 425001(2016) [2016/8]	
11	854	31957	2014A5110, 2014B5110 2014A5410, 2014B5410	ニッケル水素電池正極用高次Co化合物被膜の放射光分析	土井 修一 (株)富士通研究所
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.41-44 [2016/3]	
1	855	31840	2015A5110, 2015A5410 2015B5110, 2015B5410	Nanoparticulate BaTiO ₃ film produced by aerosol-type nanoparticle deposition	今中 佳彦 (株)富士通研究所
				Journal of Nanoparticle Research 18:102[2016/4/12]	
11	856	31223	2012B1861, 2013A1797 2014A5110, 2014B5110	硬X線光電子分光法を用いたGaN-HEMTのバンド構造解析技術開発	野村 健二 (株)富士通研究所
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.36-40 [2016/3]	
11	857	32306	2014B5130	SrTiO ₃ 単結晶のTi-K 偏光XANES および蛍光X線評価	上原 康 三菱電機(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.29-31 [2016/3]	
11	858	31307	2012B5131, 2012B5430 2013A5131, 2013A5430 2013B5131, 2014A5131	InAlNエピタキシャル薄膜の構造解析	本谷 宗 三菱電機(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.5 2015, p.32-35 [2016/3]	
1	859	32307	2011B5132, 2012B5132 2013A5130, 2013B5132	L-series X-ray emission spectra of 3d-metal compounds with various excitation conditions	上原 康 三菱電機(株)
				X-Ray Spectrom. 45, 357-362 (2016).	
1	860	31678	2012A5130, 2012B5130 2013B5130	Higher-order-structure Formation in Liquid Crystal Epoxy Thermosets Investigated by Synchrotron Radiation-Wide-angle X-ray Diffraction	前田 りな 東京工業大学 (共同研究: 三菱電機(株))
				10.1246/cl.160249	

サンビーム成果発表一覧 発表形式 2~9,12

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
9	861	32353	2013B5010, 2014A5010	積層造形品の残留応力評価	日比野 真也 川崎重工業(株)
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会) [2016/9/7-8]	
9	862	32354	2015A5310, 2015B5310 2016A5310	ガス雰囲気変動下における三元触媒のXAFS評価	松田 千明 川崎重工業(株)
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会) [2016/9/7-8]	
9	863	32447	2015A5020, 2015B5020	硬X線光電子分光法を用いたアルミ合金上の酸化膜の測定	北原 周 (株)コベルコ科研
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会) [2016/9/7-8]	
9	864	32449	2015A5320, 2015B5320 2016A5320	XAFSとSANSを併用した鋼材表面の腐食過程の評価(3)	横溝 臣智 (株)コベルコ科研
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会) [2016/9/7-8]	
9	865	29926	2013A5320, 2013B5320 2014A5320, 2014B5320	J-PARC大観による鋼材さびの乾湿過程のSANS評価その2	若林 琢巳 (株)コベルコ科研
				一般社団法人 日本鉄鋼協会 第170回 秋季講演大会 [2015/09/16-18]	
9	866	29925	2013A5320, 2013B5320 2014A5320, 2014B5320	XAFSとSANSを併用した鋼材表面の腐食過程の評価	横溝 臣智 (株)コベルコ科研
				製鋼第19委員会 製鋼計測化学研究会 第64回会議 [2015/05/28]	
9	867	29924	2013A5320, 2013B5320 2014A5320, 2014B5320	XAFSとSANSを併用した鋼材表面の腐食過程の評価(2)	横溝 臣智 (株)コベルコ科研
				第15回サンビーム研究発表会(第12回SPring-8産業利用報告会) [2015/9/3-4]	
9	868	32446	2013B5020, 2014A5020	Si添加鋼の加熱中のスケール生成挙動の観察	中久保 昌平 (株)神戸製鋼所
				第15回サンビーム研究発表会(第12回SPring-8産業利用報告会) [2015/9/3-4]	
5	869	32445	2013B5020, 2014A5020 2014B5020	SPring-8を活用したスケール生成、剥離挙動のその場観察	中久保 昌平 (株)神戸製鋼所
				鉄鋼協会・第143回圧延理論部会 優秀講演賞 [2015/11/26-27]	
9	870	32707	2013B5020, 2014A5020 2014B5020	SPring-8を活用したスケール生成、剥離挙動のその場観察	中久保 昌平 (株)神戸製鋼所
				鉄鋼協会・第143回圧延理論部会 [2015/11/26-27]	
3	871	32453	2008B5020, 2009A5020 2009B5020	Calculation of boundary conditions between internal and external oxidation in silicon and chromium containing steels	中久保 昌平 (株)神戸製鋼所
				High-Temperature Oxidation and Corrosion 2010. Materials Science Forum 696:88-93	
9	872	32708	2008B5020, 2009A5020 2009B5020	Calculation of boundary conditions between internal and external oxidation in silicon and chromium containing steels	中久保 昌平 (株)神戸製鋼所
				International Symposium on High-temperature Oxidation and Corrosion, ISHOC-10 Nov. 8-11 2010 Zushi, Japan	
2	873	32402	2009B5321	Advanced Techniques for Analyzing Corrosion Resistance of Steels for Infrastructure	中山 武典 (株)神戸製鋼所
				KOBELCO TECHNOLOGY REVIEW, No.34, 1-5,(2016).	
2	874	32403	2009B5321	Investigation on Metal Corrosion Phenomena by Using Synchrotron Radiation and Neutron Beams	中山 武典 (株)神戸製鋼所
				Corrosion Engineering, Vol.64, No.7, 226-235 (2015).	
9	875	32358	2015B5030, 2015B1870 2015B1616	放射光を用いた金属/樹脂界面の化学状態分析	久保 優吾 住友電気工業(株)
				第16回サンビーム研究発表会(第13回 SPring-8産業利用報告会) [2016/9/7-8]	
9	876	32356	2014B5330, 2015A5030 2015B5330	放射光分析を用いた電池材料の構造解析	徳田 一弥 住友電気工業(株)
				第16回サンビーム研究発表会(第13回 SPring-8産業利用報告会) [2016/9/7-8]	

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
9	877	32285	2014A5340, 2014B5340 2015A5340	リチウムイオン二次電池正極活物質のin situ XAFS解析	後藤 習志
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	ソニー(株)
9	878	31916	2015B5360	エックス線吸収微細構造(XAFS)法によるMOCVD成長ゲルマニウムスズ(GeSn)薄膜	臼田 宏治
				応用物理学会学術講演会 [2016.03.19-03.22]	(株)東芝
8	879	31917	2014A5060, 2014B5060 2015A5060, 2015B5060	硬X線光電子分光法(HAXPES)によるゲルマニウムスズ薄膜の深さ方向化学結合状態評価	臼田 宏治
				SPring-8利用推進協議会次世代先端デバイス研究会 [2016.03.18]	(株)東芝
8	880	31918	2014A5060, 2014B5060 2015A5060, 2015B5060	硬X線光電子分光法によるゲルマニウムスズ薄膜の深さ方向結合状態評価	臼田 宏治
				第10回九州シンクロトロン光研究センター研究成果報告会 [2016.08.03]	(株)東芝
9	881	31919	2014A5060, 2014B5060 2015A5060, 2015B5060	Depth Characterization of Chemical States in GeSn Thin Film by HAXPES	臼田 宏治
				MRS Spring Meeting [2016.03.28-04.01]	(株)東芝
5	882	31994	2014A5060, 2014B5060 2015A5060	硬X線光電子分光(HAXPES)法によるゲルマニウムスズ(GeSn)薄膜の深さ方向組成評価	臼田 宏治
				第15回サンビーム研究発表会(第12回SPring-8産業利用報告会) [2015/9/3-4]	(株)東芝
9	883	32334	2015A5060, 2015B5060 2016A5060	HAXPESによる半導体薄膜の深さ方向分析	吉木 昌彦
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	(株)東芝
9	884	32348	2014A5360, 2014B5360 2015A5360, 2015B5360 2016A5360	XAFS法によるMOCVD成長GeSn薄膜の局所構造評価	臼田 宏治
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	(株)東芝
9	885	31910	2012A5350, 2012B5320 2013A5350, 2013B5350 2014A5350, 2014B5350	XAFS Speciation of Trace Elements in By-Product from Coal Combustion Plant	山本 融
				15th Workshop on Progress in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry [2016/09/04-09/08]	(一財)電力中央研究所
8	886	31911	2012A5351, 2012B5320, 2013A5350 2013B5350, 2014A5350, 2014B5350 2015A5350, 2015B5350, 2016A5350	放射光分析による微量物質の挙動解明に向けた取り組み	山本 融
				第10回九州シンクロトロン光研究センター研究成果報告会 [2016/08/03]	(一財)電力中央研究所
9	887	31951	2014A5350, 2014B5350 2015A5350, 2015B5350	混合正極中のスピネル酸化物と層状酸化物の劣化解析	小林 剛
				第56回電池討論会 [2015/11/11-11/13]	(一財)電力中央研究所
9	888	31952	2014A5350, 2014B5350 2015A5350, 2015B5350	リチウム二次電池における層状酸化物正極の劣化挙動解析	小林 剛
				粉体工学会主催第51回技術討論会 [2016/06/14-6/15]	(一財)電力中央研究所
8	889	31953	2014A5350, 2014B5350 2015A5350, 2015B5350	リチウム二次電池における層状酸化物正極の劣化挙動解析	小林 剛
				第38回電池技術委員会 講演会 [2016/06/17]	(一財)電力中央研究所
9	890	31954	2014A5350, 2014B5350 2015A5350, 2015B5350	A novel quantitative diagnostic technique for charge-discharge degradation mechanism of spinel and layered oxides in blended cathode of lithium-ion battery	小林 剛
				18th International Meeting on Lithium Batteries (IMLB2016) [2016/06/19-06/24]	(一財)電力中央研究所
5	891	31955	2014A5350, 2014B5350 2015A5350, 2015B5350	LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2の充放電劣化挙動の解明	小林 剛
				公益財団法人電気化学会電池技術委員会 電池技術委員会賞 [2015/11/12]	(一財)電力中央研究所
9	892	32065	2013A5050, 2013B5050 2014A5050, 2014B5050	SPring-8放射光によるガスタービン動翼材のクリープ損傷評価	向井 康博
				火力原子力発電技術協会 研究発表会 [2015/12/03]	関西電力(株)

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
9	893	32070	2014B5050, 2015A5050 2015B5050, 2016A5050	放射光X線回折法によるガスタービン動翼Ni基超合金の損傷評価	向井 康博
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	関西電力(株)
9	894	32309	2011B5370, 2012A5370 2012B5370, 2013A5370	Characterization of Helical Dislocations in Ammonothermal GaN Substrate by Heat Treatment+A1	堀淵 嘉代
				The 18th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-18) [2016/8/7-12]	(株)豊田中央研究所
8	895	32320	2012A5371, 2013A5370 2014A5370, 2014B5371	Solution growth of high-quality 4H-SiC bulk crystals - Trials of dislocation-free bulk growth-	旦野 克典
				International Workshop on Wide-Bandgap Semiconductor Power Electronics [2016/5/21-22]	トヨタ自動車(株)
9	896	32312	2011B5370, 2012A5370 2012B5370, 2013A5370	アモソーマル法で作製されたGaN基板中のつる巻きバネ状転位の解析	堀淵 嘉代
				秋季 応用物理学学会学術講演会 [2015/9/13-16]	(株)豊田中央研究所
9	897	32313	2011B5370, 2012A5370 2012B5370, 2013A5370	GaN単結晶の転位の熱挙動解析	山口 聡
				日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム [2016/1/9-11]	(株)豊田中央研究所
9	898	32314	2011B5370, 2012A5370 2013B5370, 2014A5370 2014B5371, 2015A5371 2015B5370	X線トポグラフィ向け原子核乾板の検討	山口 聡
				日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム [2016/1/9-11]	(株)豊田中央研究所
9	899	32315	2011B5370, 2012A5370 2012B5370, 2013A5370	GaN結晶中のヘリカル転位の解析	堀淵 嘉代
				日本顕微鏡学会第72回学術講演会 [2016/6/14-16]	(株)豊田中央研究所
9	900	32316	2011B5370, 2012A5370 2012B5370, 2013A5370	GaN単結晶の転位の熱挙動解析	山口 聡
				2016年度第1回X線トポグラフィ研究会 [2016/8/5]	(株)豊田中央研究所
9	901	32362	2014B5071, 2015A5071 2015B5071	HAXPESIによるリチウム二次電池の分析	高橋 直子
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	(株)豊田中央研究所
9	902	32323	2015B5070	SR-XRFによるパワーコントロールユニット用半導体素子の分析	小坂 悟
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	(株)豊田中央研究所
9	903	32321	2012A5371, 2013A5370 2014A5370, 2014B5371	溶液法SiC単結晶のX線トポグラフィ観察	山口 聡
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	(株)豊田中央研究所
9	904	32317	2015A7027, 2015A5372 2015B7027, 2015B5371	バイメタリック触媒のoperando 3次元原子分布解析	西村 友作
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	(株)豊田中央研究所
9	905	31517	2014B5071, 2015A5071 2015B5071	Li二次電池負極SEIのHAXPES分析	高橋 直子
				第51回X線分析討論会[2015/10/29-30]	(株)豊田中央研究所
9	906	32226	2015A5380, 2015B5380 2016A5380	偏光XAFS及びFEFFを用いたInGaN結晶のIn分布可視化(2)	吉成 篤史
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	日亜化学工業(株)
9	907	32006	2014B5080, 2014B5380	完全結晶に近い高結晶性試料のX線回折測定	宮野 宗彦
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	日亜化学工業(株)
8	908	31869	2014A5080, 2014B5080 2015A5080	GaN系高効率LEDの発展と材料評価の役割	榊 篤史
				カメカテクニカルセミナー2015 [2015/10/23]	日亜化学工業(株)
5	909	31870	2014A5080, 2014B5080 2015A5080	放射光マイクロビームX線による高効率LED発光層の評価	榊 篤史
				SPring-8利用推進協議会総会・研究開発委員会 受賞記念講演 [2016/4/13]	日亜化学工業(株)

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
8	910	31871	2014A5080, 2014B5080 2015A5080	放射光マイクロビームX線によるInGaN発光層の評価	榊 篤史 日亜化学工業(株)
				第8回 窒化物半導体結晶成長講演会 [2016/5/9-10]	
8	911	31872	2014A5080, 2014B5080 2015A5080	放射光を利用した高効率LEDの評価	榊 篤史 日亜化学工業(株)
				第10回 九州シンクロトン光研究センター研究成果報告会 [2016/8/3]	
5	912	29856	2012A5392, 2012A5090, 2012B5392 2013A5091, 2013A5392, 2013B5391 2013B5392, 2014A5091, 2014A5392 2014B5092	リチウムイオン電池の電子の動きを可視化する技術開発と電気自動車用高容量電池開発への寄与	今井 英人 (株)日産アーク
				第13回ひょうごSPring-8賞 [2015/9/1]	
8	913	29857	2012A5392, 2012A5090, 2012B5392 2013A5091, 2013A5392, 2013B5391 2013B5392, 2014A5091, 2014A5392 2014B5092	リチウムイオン電池の電子の動きを可視化する技術開発と電気自動車用高容量電池開発への寄与	今井 英人 (株)日産アーク
				第15回サンビーム研究発表会(第12回SPring-8産業利用報告会) [2015/9/3-4]	
8	914	29855	2013B5391, 2014A5391	Recent topics on x-ray analysis on fuel cell catalysts	今井 英人 (株)日産アーク
				227th Electrochemical Society Meeting [2015/5/24-28]	
9	915	28066	2014A5090	A Haxpes Study on Solid Electrolyte Interphase Formed on a Carbon Negative Electrode	松本 匡史 (株)日産アーク
				226th Meeting of The Electrochemical Society [2014/10/5-9]	
9	916	29690	2014B5420	XAFS測定による酸化物薄膜材料の構造解析	相良 暁彦 パナソニック(株)
				第15回サンビーム研究発表会(第12回SPring-8産業利用報告会) [2015/9/3-4]	
9	917	32304	2015A5120	Pt / Y:BaZrO3 界面における全固体電気二重層の形成、および、高プロトン濃度空間電荷層の分析	浅野 哲也 パナソニック(株)
				第41回固体イオニクス討論会(2015/11)	
9	918	32305	2014B5120	Direct Evidences for Ion Accumulation at the Pristine Interface between a Solid State Oxide Electrolyte and a Metal Electrode	浅野 哲也 パナソニック(株)
				2015 MRS Fall Meeting(2015/12)	
8	919	32369	2010B5100	X線反射率法の応用(2) 磁性体多層膜への応用	上田 和浩 (株)日立製作所
				第6回講習会 X線反射率による薄膜・多層膜の解析 [2016/08/25]	
9	920	32370	2015A5400, 2015A5400	スカントポグラフィ法を用いたSiCウェハの定量的な結晶歪みの検出	米山 明男 (株)日立製作所
				応用物理学学会学術講演会[2016/3]	
9	921	32371	2015A5400, 2015A5400 2016A5400	スカントポグラフィ法によるSiCウェハの定量的な結晶歪みの検出	米山 明男 (株)日立製作所
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	
9	922	32372		サンビームにおける多機能走査型X線顕微鏡の開発	米山 明男 (株)日立製作所
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	
9	923	32373	2014B5100, 2014A5100 2013B5100, 2013A5100	Mea: 架橋ポリエチレン被覆材の銅拡散状態分布の解析	百生 秀人 日立金属(株)
				Journal of Physics D: Applied Physics 49, 425001(2016) [2016/8]	
9	924	32374		圧電素子を用いた高速走査型X線顕微鏡の開発	米山 明男 (株)日立製作所
				日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム [2016/1]	
9	925	32390	2015A5400, 2105B5400 2014B5400, 2014A5400	金属イオン拡散を抑制する高信頼性半導体材料の開発と拡散抑制機構の検証	中山 紀行 日立化成(株)
				エレクトロニクス実装学会第30回講演大会[2016/3]	
9	926	32391	2015A5400, 2105B5400 2014B5400, 2014A5400	金属イオン拡散を抑制する高信頼性半導体材料の開発と拡散抑制機構の検証	中山 紀行 日立化成(株)
				エレクトロニクス実装学会第26回2016ワークショップ [2016/9]	

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
9	927	32364	2015A5110, 2015A5410 2015B5110, 2015B5410	BaTiO ₃ ナノ粒子膜の放射光による構造評価	淡路 直樹 (株)富士通研究所
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	
9	928	31308	2012B5131, 2013A5131 2013B5131, 2014A5131	製品開発現場における微小角入射X線回折(GIXD)法の利用	本谷 宗 三菱電機(株)
				日本表面科学会第1回関東支部講演大会[2016.04.09]	
9	929	31936	2012B5131, 2013A5131 2013B5131, 2014A5131	微小角入射X線回折法による窒化物半導体表面の構造解析	本谷 宗 三菱電機(株)
				第47回表面分析研究会 [2016.06.23-06.24]	
9	930	32367	2015A5130, 2015B5130 2016A5130	原子層堆積法および熱処理における界面反応の酸化種依存性	諏訪 智之 東北大学 (共同研究: 三菱電機(株))
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	
9	931	32308	2015A5431, 2015B5431 2015A1963	冷凍過程による食品の構造変化	須藤 和幸 三菱電機(株)
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会)[2016/9/7-8]	

編集後記

「サンビーム年報・成果集 vol.6」を無事発刊することができました。原稿をご担当いただいたサンビーム共同体のメンバーの方々には厚く御礼を申し上げます。また、本年の編集委員会の主体は住友電気工業株式会社の皆様に担っていただきました。毎年、編集委員会の主体を担う社の方々には大変なご苦勞をおかけしています。心より御礼を申し上げる次第です。

私たちサンビーム共同体は SPring-8 BL16XU と BL16B2 のビームラインを利用させていただくにあたり、ふたつの義務を負っています。ひとつは、各社が抱えている製品開発、生産、製品の維持保全等に関わる諸問題に対して、放射光利用の特徴を活かした分析手法を考え、提案・実行してそれらの解決に貢献していくこと、今一つはそれらの結果を広く世の中に公表していくことです。本「サンビーム年報・成果集」は後者の目的のための非常に重要な媒体で、幸いなことに SPring-8 成果審査委員会から、利用成果の「公開技術報告書」として公式に認定していただいております。専用ビームラインで行う実験課題の特徴としては、ひとつの大きな問題に対して継続的、かつ計画的な取り組みが可能であること、十分な結果が得られる確証がない状態での挑戦的な取り組みが可能であること、などがあります。このような実験課題の結果は、「3年以内に論文の形で結果公表」という SPring-8 の成果公開の原則にはそぐわない場合もあり、本誌はそのような実験課題の成果公開の場でもあります。最近では本誌で公表した成果をまとめて論文の形で投稿するケースも少しずつ出てきておりますが、本誌にのみ成果を公表している実験課題は数多くあり、本誌は専用ビームラインを用いた放射光の産業利用活動の一端を非常によく示したものと考えています。ご一読の上、忌憚のないご意見、ご鞭撻を賜れば大変幸いです。

サンビーム共同体 2016 年度合同部会長・編集委員長
株式会社豊田中央研究所 妹尾与志木

サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016

2017年3月発行

発行 産業用専用ビームライン建設利用共同体

編集 サンビーム共同体編集委員会

編集委員長	妹尾 与志木	(株)豊田中央研究所
副編集委員長	河瀬 和雅	三菱電機(株)
広報SG主査	中山 明	住友電気工業(株)
編集委員	種子田 賢宏	住友電気工業(株)
	菅 郁美	住友電気工業(株)
	小森 和彦	サンビーム共同体事務局

〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1

公益財団法人高輝度光科学研究センター内

産業用専用ビームライン建設利用共同体事務局

TEL : 0791-58-1839 FAX : 0791-58-1830

URL : <https://sunbeam.spring8.or.jp>

印刷 (株)佐藤印刷所

著作権法に基づき、本書のいかなる形式の複製または転載も、
当該箇所の著作者による事前の許可が必要です。



産業用専用ビームライン建設利用共同体

SUNBEAM Consortium